



## IEC 品質認証制度(IECQ)

IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

# IECQ認証書 独立試験所

IECQ 証明書番号:	IECQ-L JQAJP 13.0002	発行番号:	12	認証状況:	継続中
旧認証書番号:	IECQ-L JQAJP 13.0002 第 11 版	発行日:	2025/12/26	初回発行日:	2009/12/18
CB 管理番号:	JQAQ0002-001-T	有効期限:	2026/12/23		

### 沖エンジニアリング株式会社 本社

〒179-0084 東京都練馬区氷川台 3-20-16 OEGビル

当該組織、設備及びその手順は、この認証書を発行したIECQ 認証機関により IECQ 03-1 および IECQ 03-6 に従って評価され、IECQ 独立試験所審査プログラム要求スキーム 及び ISO/IEC 17025:2017のIECQ制度における電子部品試験に適用される項目について審査の結果、独立試験所に要求される該当項目に適合することを確認しました。

#### 認証範囲:

- 環境試験
- 強度試験

認証範囲の詳細については添付 付属書を参照

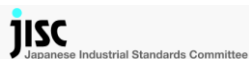
詳細は添付 付属書参照

発行認証機関 (CB) : Japan Quality Assurance Organization (JQA)  
一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門  
〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目 4 番地 4

部門長: 平 岩 貞 浩



#### 後援会員団体



この認証の妥当性は、この認証書の発行認証機関による定期的なサーベイランス調査の実施によって維持されます。

注記: この認証は IECQ の施行規則に基づき、認証の停止又は取り消しとなる場合があります。

この認証書及びその付属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。

[www.iecq.org](http://www.iecq.org)



## IEC 品質認証制度 (IECQ)

IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

### 附属書

## 独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002

CB 管理番号: JQAQ0002-001-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-S

改訂番号: 12 改訂日: 2025/12/26

ページ 1/2

### 試験対象部品

固定コンデンサ、固定抵抗器、半導体集積回路

### 環境試験

IEC 60068-2-1:2007

低温（耐寒性）試験

IEC 60068-2-2:2007

高温（耐熱性）試験

### 強度試験

JEITA ED-4701/302B:2020

半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験 I-2）

試験方法 305E デバイス帯電モデル静電破壊試験（CDM/ESD）

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトで確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)



一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目 4 番地 4



## IEC 品質認証制度 (IECQ)

IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

### 附属書

## 独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002

CB 管理番号: JQAQ0002-001-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-S

改訂番号: 12 改訂日: 2025/12/26

ページ 2/2

### 測定範囲

#### 受動部品

品種／部品名	測定可能な特性値：	測定範囲
固定コンデンサ	(1) 耐電圧（直流）：	AC、DC 0 ～ 5kV
	(2) 絶縁抵抗：	$5 \times 10^5 \Omega \sim 10^{14} \Omega$
	(3) 漏れ電流：	$1 \times 10^{-3} \text{ A} \sim 10^{-11} \text{ A}$
	(4) 静電容量：	18pF* ～ 1F*
	(5) 誘電正接(Dファクタ)：	10*以下
	(6) インピーダンス：	$1 \Omega \sim 10^6 \text{ M}\Omega$
注：*印は測定電圧により異なる		
固定抵抗器	(1) 抵抗値：	$1 \Omega \sim 100 \text{ M}\Omega$
	(2) 絶縁抵抗：	$5 \times 10^5 \Omega \sim 2 \times 10^{14} \Omega$
	(3) 耐電圧：	AC、DC 0 ～ 5kV
デジタル集積回路 ・ CMOS IC	(1) 高レベル出力電圧：	±30V
	(2) 低レベル出力電圧：	±30V
	(3) 高レベル入力電圧：	±20V
	(4) 低レベル入力電圧：	±20V
	(5) 高レベル出力電流：	±300mA
	(6) 低レベル出力電流：	±300mA
	(7) 静的消費電流：	±300mA
	(8) 入力電流：	±300mA

この附属書は、認証書と使用したときのみに有効です。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)



一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目4番地4